

从Nordlys升级到Symmetry S2

新的Symmetry S2是第二代全能型EBSD探测器。它不仅能够在几秒钟内以超过4500个花样/秒(pps)的速度对样品进行表征，而且专门定制设计的CMOS传感器还可以采集无畸变的、百万像素分辨率衍射花样，从而实现精细的相鉴定和高角度分辨率(HR)EBSD分析。为获得极端灵敏度，开发利用了独特的光纤板光学系统，Symmetry S2是满足您现在和未来所有应用需求的一款理想的EBSD探测器。

此次升级将使您的实验室达到全新的EBSD技术水平：不仅全面提升EBSD的采集能力，而且还将获得我们全新开发的AZtecCrystal数据处理软件包，进一步提高晶体材料的表征能力。

1. 市场领先的分析速度

- 保证采集速度 >4500pps
- 晶粒大小和织构表征在2分钟内完成

2. 无与伦比的灵敏度

- 光纤板光学系统带来低束流条件下的快速分析速度
- 束流敏感和挑战性样品上令人惊叹的性能

3. 丰富多彩的功能模块

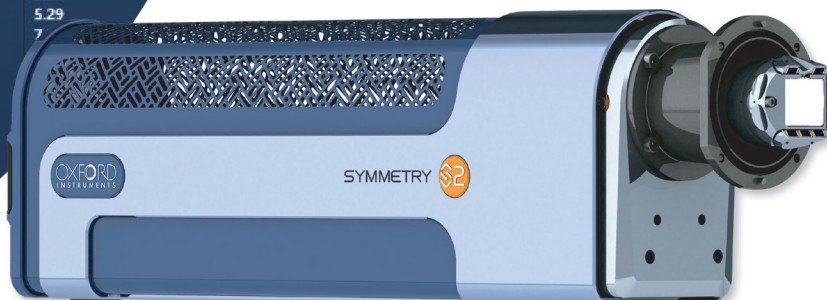
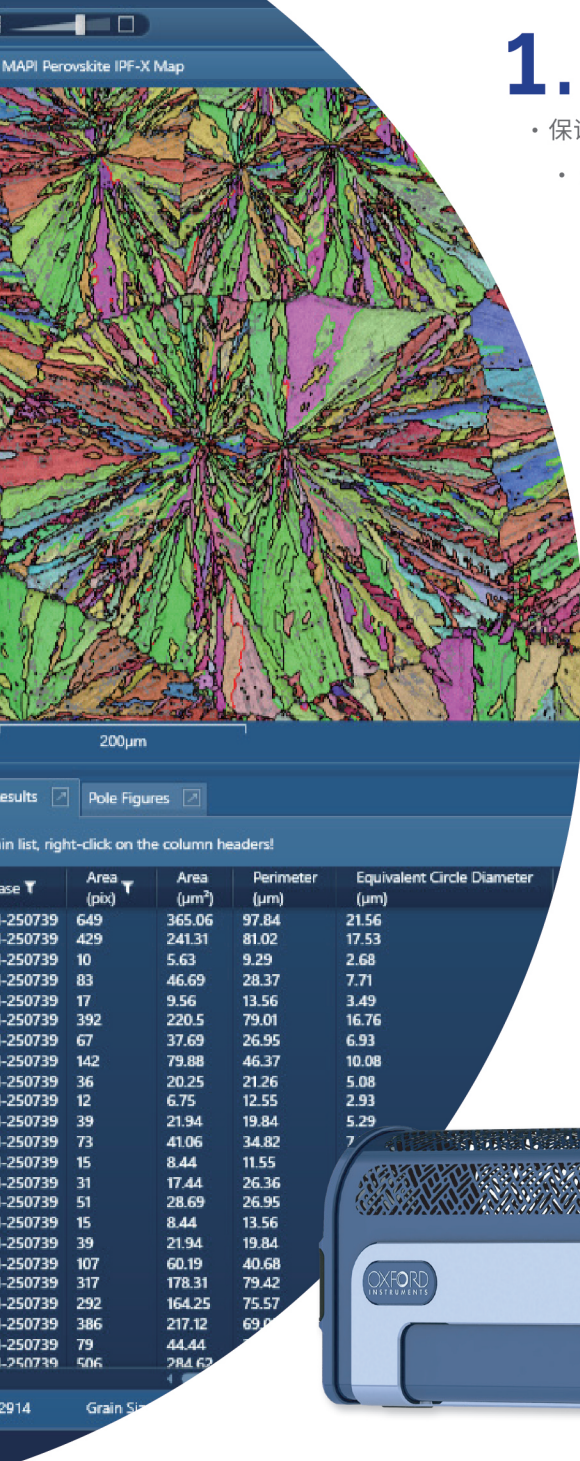
- 软件控制探测器高度可调：确保任何大小和类型的样品在合适的几何位置上采集
- 专利技术的接近传感器：避免了昂贵损失的碰撞发生

4. 一目了然的数据处理—AZtecCrystal

- 为快速处理和方便使用而设计
- 多种先进功能，包括弹性性能和批量处理

5. 预见未来的实验室建设

- 采用最新软件的全新超高规格Windows 10 电脑
- 为未来研究提供无限可能



了解更多信息：

如您希望了解更多信息，请拨打销售及服务热线 400 678 0609 或登录官方网站

升级指标

SYMMETRY S2 EBSD 探测器

专门定制设计的基于 CMOS 的 EBSD 探测器，适合所有应用：

多个相机模式	分辨率模式	1244 x 1024 像素，速度 >240 pps
	灵敏度模式	622 x 512 像素，速度 >250 pps
	速度模式 1	622 x 512 像素，速度 >800 pps
	速度模式 2	156 x 128 像素，速度 >3000 pps
	速度模式 3	156 x 88 像素，速度 >4500 pps
最高灵敏度*	>800 pps/nA	
倾转接口	软件控制	
光纤板光学系统	是	
光学畸变	保证 < 1 像素	
接近传感器	是	
集成 FSD 探测器	多至 5 个 (选配)	
红外滤镜	选配	

*在 Ni 合金上的典型性能

AZTECCRYSTAL 高级配置

现代化、独立运行的 EBSD 数据处理软件，设计用于直观、强大的数据分析

数据格式	· 全新 *.h5oinda HDF5 数据格式，用于存储 EDS 和 EBSD 数据
数据去噪	· 手动去除错标和零解 · 自动去噪功能，可保存去噪配方 · 去除伪对称错标
面分布图显示	· 使用选项卡或平铺显示创建多个面分布图 · 超过 30 种可定制的图层
晶粒大小分析	· 快速晶粒探测和分析，符合 ASTM 标准 · 交互式晶粒列表，可统计孪晶粒
织构分析	· 完整灵活的极图和反极图绘制 · 取向差分布函数(ODF)功能用于高级织构研究
测量工具	· 绘制并编辑微观组织的截线 · 比对参数变化和取向差
晶界分析	· 晶界取向差分布分析 · 完整的晶界长度统计和分析 · 旋转轴表征
相分类工具	· 基于机器学习的相分类工具 · 是区分再结晶和变形、马氏体和铁素体的理想工具
材料性能	· 基于取向数据，测量并绘制弹性性能 · 计算整体平均值
子集工具	· 完整的子集功能 · 完整分析每个微观组织的组成部分
模板	· 模板工具适合数据的快速绘制和显示 · 批量处理模板可一键完成完整的数据处理